

δ 卷积与反卷积——Unfolding 的频域本质

本文从 δ 函数与高斯核的卷积/反卷积出发，在频域中揭示 Unfolding 问题病态性的数学根源，以及正则化方法如何在高频端截断噪声放大。

一、正演： δ 函数卷积成高斯分布

1.1 卷积定义

两个函数 $f(x)$ 和 $g(x)$ 的卷积定义为：

$$(f * g)(x) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x') g(x - x') dx'$$

卷积的物理含义： f 的每一个点 x' 被核 g "涂抹"到周围区域， $g(x - x')$ 给出涂抹的权重。

1.2 δ 函数与高斯核卷积

取 $f(x) = \delta(x - x_0)$ (位于 x_0 处的 Dirac δ 函数)，核函数为高斯：

$$k(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_0} \exp\left(-\frac{x^2}{2\sigma_0^2}\right)$$

其中 σ_0 是探测器的分辨率 (如刚度分辨率 σ_R)。

利用 δ 函数的筛选性质 $\int \delta(x' - x_0) h(x') dx' = h(x_0)$ ，代入 $h(x') = k(x - x')$ ：

$$\begin{aligned}(\delta * k)(x) &= \int_{-\infty}^{\infty} \delta(x' - x_0) \cdot \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_0} \exp\left(-\frac{(x - x')^2}{2\sigma_0^2}\right) dx' \\ &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_0} \exp\left(-\frac{(x - x_0)^2}{2\sigma_0^2}\right) \\ &= G(x; x_0, \sigma_0)\end{aligned}$$

结论： δ 函数与高斯核卷积，结果是以 x_0 为中心、宽度 σ_0 的高斯分布。

物理对应：一个原本具有精确刚度 R_0 的粒子 ($\delta(R - R_0)$)，经过有限分辨率的探测器测量后，重建刚度呈现为以 R_0 为中心、宽度 σ_R 的高斯分布。这就是迁移矩阵在连续极限下的形式——响应矩阵的第 j 列 (对应真实 bin j) 正是高斯核在离散 bin 中的采样。

1.3 推广：任意分布与高斯核卷积

若原始分布 $f(x)$ 不是 δ 函数而是任意谱形，卷积结果称为 **Folding**：

$$m(x) = (f * k)(x) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x') \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_0} \exp\left(-\frac{(x-x')^2}{2\sigma_0^2}\right) dx'$$

这就是测量谱 $m(x)$ (即 Unfolding 中的 g) 与真实谱 $f(x)$ (即 f) 和探测器分辨率核 $k(x)$ (即响应矩阵 \mathbf{A} 的连续极限) 之间的关系。

卷积操作对信息的影响:

- δ 函数 (无限尖锐) \rightarrow 高斯 (有限宽度 σ_0)
- $f(x)$ 中尺度小于 σ_0 的结构 \rightarrow 在 $m(x)$ 中被抹平
- 高频细节 (亚分辨率结构) \rightarrow **不可逆地丢失**

二、反演：高斯分布反卷积成 δ

2.1 卷积定理

傅里叶变换将卷积变为乘积——这是解反卷积问题的核心工具:

$$\mathcal{F}[f * k](\omega) = \mathcal{F}[f](\omega) \cdot \mathcal{F}[k](\omega)$$

其中傅里叶变换定义为:

$$\mathcal{F}[f](\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x) e^{-i\omega x} dx$$

高斯函数的傅里叶变换仍是高斯 (这是高斯函数的独特性质):

$$\mathcal{F}[G(x; 0, \sigma)](\omega) = \exp\left(-\frac{\sigma^2 \omega^2}{2}\right)$$

关键观察: 高斯在时域 (bin 空间) 宽度为 σ , 在频域宽度为 $1/\sigma$ 。窄高斯 (尖锐) \rightarrow 宽频域分布 (包含更多高频分量)。

2.2 无噪声情况：解析可解

问题: 已知测量谱 $m(x) = G(x; 0, \sigma)$ 和探测器分辨率核 $k(x) = G(x; 0, \sigma_0)$, 求原始分布 $f(x)$ 使得 $f * k = m$ 。

频域求解:

$$\mathcal{F}[f](\omega) = \frac{\mathcal{F}[m](\omega)}{\mathcal{F}[k](\omega)} = \frac{\exp(-\sigma^2 \omega^2 / 2)}{\exp(-\sigma_0^2 \omega^2 / 2)} = \exp\left(-\frac{(\sigma^2 - \sigma_0^2) \omega^2}{2}\right)$$

再做逆傅里叶变换, 仍是一个高斯:

$$f(x) = G\left(x; 0, \sqrt{\sigma^2 - \sigma_0^2}\right)$$

三种情况分析：

情况	σ vs σ_0	$f(x)$ 的结果	物理含义
$\sigma > \sigma_0$	测量宽度 > 分辨率	高斯，宽度 $\sqrt{\sigma^2 - \sigma_0^2}$	原始分布本身有内在宽度，分辨率只是额外展宽
$\sigma = \sigma_0$	测量宽度 = 分辨率	$\delta(x)$	测量到的宽度完全由探测器分辨率解释——原始分布就是 δ
$\sigma < \sigma_0$	测量宽度 < 分辨率	虚数宽度 \rightarrow 无实数解	物理上不可能 ：测量谱的宽度不能小于探测器分辨率

无噪声情况下的结论是乐观的：理论上，反卷积可以精确恢复 δ 函数。如果真实谱确实是 $\delta(x)$ ，且我们能无限精确地知道测量谱 $m(x) = G(x; 0, \sigma_0)$ 的完整函数形式（即每个 x 点的值都精确已知），那么做除法 $\mathcal{F}[m]/\mathcal{F}[k]$ 确实能恢复 $\mathcal{F}[\delta] = 1$ 。

三、有噪声时：灾难性的高频放大

无噪声推导假设我们精确知道 $m(x)$ 的连续函数形式。实际上测量谱 $m_{\text{meas}}(x)$ 是统计样本的直方图，每 bin 的事例数带有泊松涨落：

$$m_{\text{meas}}(x) = m_{\text{true}}(x) + \varepsilon(x)$$

其中 $\varepsilon(x)$ 是 bin-by-bin 的统计噪声。

3.1 频域中噪声的致命放大

将含噪测量谱代入反卷积：

$$\mathcal{F}[f_{\text{est}}](\omega) = \frac{\mathcal{F}[m_{\text{meas}}](\omega)}{\mathcal{F}[k](\omega)} = \frac{\mathcal{F}[m_{\text{true}}](\omega)}{\mathcal{F}[k](\omega)} + \frac{\mathcal{F}[\varepsilon](\omega)}{\mathcal{F}[k](\omega)}$$

第一项是真实信号；**第二项是灾难**。噪声 $\varepsilon(x)$ 是逐 bin 独立的随机涨落，其傅里叶变换 $\mathcal{F}[\varepsilon](\omega)$ 在所有频率上近似平坦（白噪声特性）——高频分量的幅度与低频分量在同一量级。

但分母 $\mathcal{F}[k](\omega) = \exp(-\sigma_0^2\omega^2/2)$ 在高频端**指数衰减**。因此反卷积核：

$$\frac{1}{\mathcal{F}[k](\omega)} = \exp\left(+\frac{\sigma_0^2\omega^2}{2}\right)$$

在高频端**指数增长**。噪声项变为：

$$\frac{\mathcal{F}[\varepsilon](\omega)}{\mathcal{F}[k](\omega)} = \mathcal{F}[\varepsilon](\omega) \cdot \exp\left(+\frac{\sigma_0^2\omega^2}{2}\right) \xrightarrow{\omega \rightarrow \infty} \infty$$

3.2 数值演示

取 $\sigma_0 = 1$ (以 bin 宽为单位)。在空间频率 $\omega = 5$ 处 (对应空间周期约 $2\pi/5 \approx 1.26$ bin——即相邻 bin 的逐 bin 振荡):

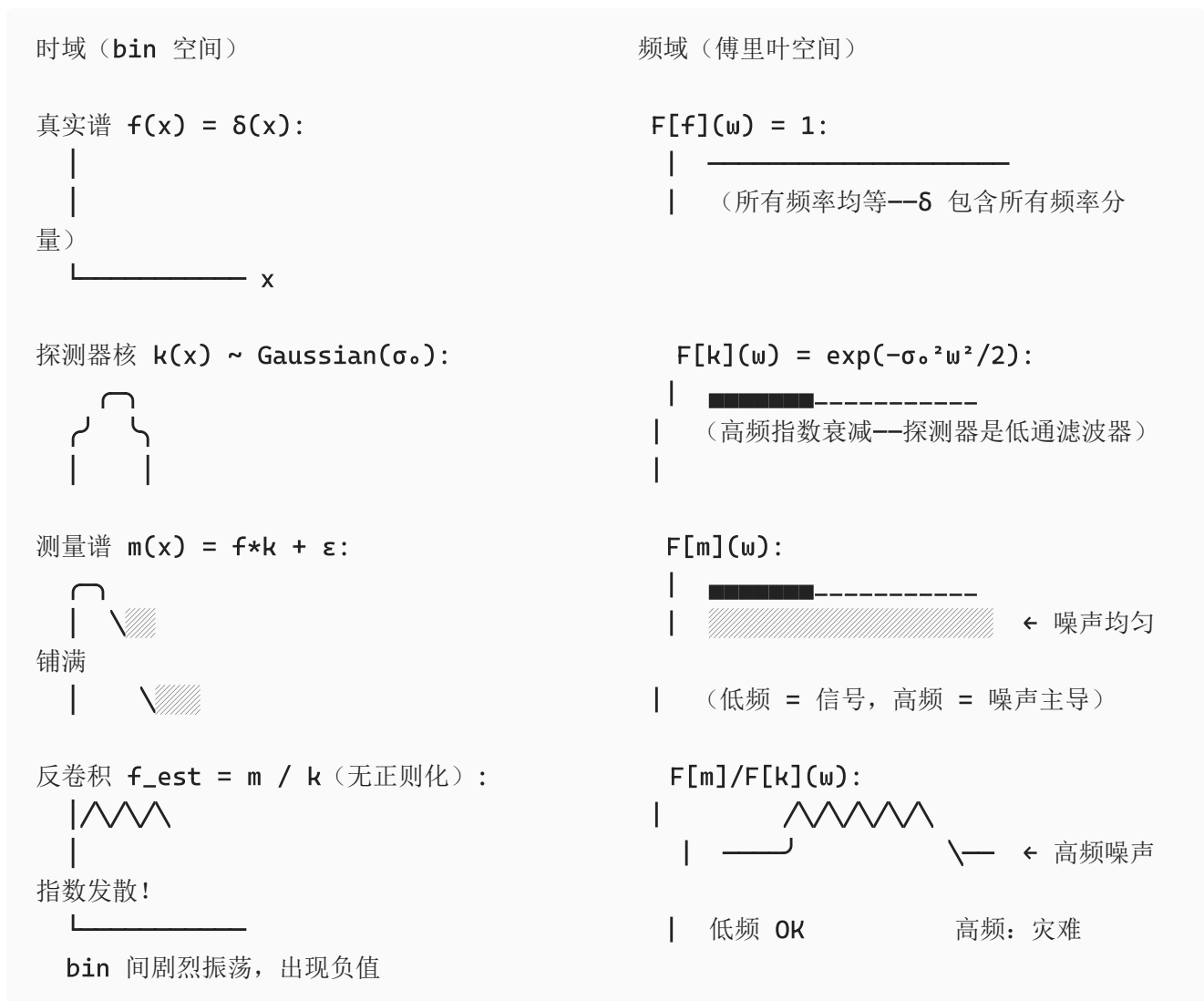
$$\frac{1}{\mathcal{F}[k](5)} = \exp\left(+\frac{1^2 \cdot 5^2}{2}\right) = \exp(12.5) \approx 2.7 \times 10^5$$

在 $\omega = 10$ 处 (尺度约 0.63 bin 的振荡——完全不可物理分辨):

$$\frac{1}{\mathcal{F}[k](10)} = \exp(50) \approx 5.2 \times 10^{21}$$

结论: 即使噪声在高频分量上的原始幅度仅 10^{-2} (1% 的 bin 向统计涨落), 经过 10^{21} 倍的放大后, 也足以将真实信号完全淹没。

3.3 物理图像



3.4 离散视角: 从 SVD 理解

在离散化的 Unfolding 问题中, 频域分析等价于 SVD 分解的奇异值谱。连续傅里叶变换中的高频 ω 对应 Small SVD 中的小奇异值 σ_k (k 大)。关系为:

$$\sigma_k \propto \exp\left(-\frac{\sigma_0^2}{2} \cdot \frac{k^2}{L^2}\right)$$

其中 L 是测量范围。因此：

- $k = 1, 2, 3$ (大奇异值) \rightarrow 低频模式 \rightarrow 对噪声不敏感
- $k \rightarrow m$ (小奇异值) \rightarrow 高频模式 \rightarrow 反演时除以 $\sigma_k \approx 0 \rightarrow$ 噪声放大 $\rightarrow \infty$

这与 [Unfolding 文档 §3.2](#) 中的分析完全一致：小奇异值对应的高频模式在直接反演中被指数放大。

四、正则化如何在频域中拯救反卷积

4.1 四类方法的频域等价操作

所有 Unfolding 方法本质上都是在频域限制高频放大因子。回顾一般形式的正则化解：

$$\mathcal{F}[f_{\text{reg}}](\omega) = \phi(\omega) \cdot \frac{\mathcal{F}[m](\omega)}{\mathcal{F}[k](\omega)}$$

其中 $\phi(\omega)$ 是频率依赖的衰减因子（等效于滤波器）。

方法	$\phi(\omega)$ 的形式	频域含义
无正则化（直接反卷积）	$\phi(\omega) \equiv 1$	所有频率分量均等对待 \rightarrow 高频噪声发散
SVD 硬截断	$\phi(\omega) = \begin{cases} 1, & \omega \leq \omega_{\text{max}} \\ 0, & \omega > \omega_{\text{max}} \end{cases}$	ω_{max}
Tikhonov 正则化	$\phi(\omega) = \frac{1}{1 + \lambda \omega^2}$	λ
贝叶斯迭代	$\phi(\omega)$ 随迭代步数增加逐渐趋近 1	低分辨率信息先注入，高分辨率信息逐次释放——有限次迭代 = 有限频率带宽
Bin-by-bin 修正	$\phi(\omega) \equiv 0$ (对所有 $\omega \neq 0$)	完全不对 bin 间迁移做任何反演——等于放弃恢复所有亚 bin 宽度的结构

4.2 SVD 截断在频域的等价形式

在连续极限下，SVD 截断至 k_{max} 个奇异值等价于设置截止频率 ω_{max} ，使得 $\sigma_0 \omega_{\text{max}} \approx \sqrt{2 \ln(m/k_{\text{max}})}$ 。

截止频率与可恢复的最细结构尺度的关系：

$$\Delta x_{\text{min}} \approx \frac{\pi}{\omega_{\text{max}}} \approx \frac{\pi \sigma_0}{\sqrt{2 \ln(m/k_{\text{max}})}} \sim \sigma_0$$

物理结论：无论采用何种正则化方法，你承诺能恢复的最细 bin 结构尺度不可能小于探测器分辨率 σ_R 本身。任何声称能从反卷积中恢复比 σ_R 更细之结构的说法，在数学上等价于提取被 $e^{+\sigma_R^2 \omega^2/2}$ 倍增放大的噪声分量。

4.3 Tikhonov 正则化与维纳滤波的等价性

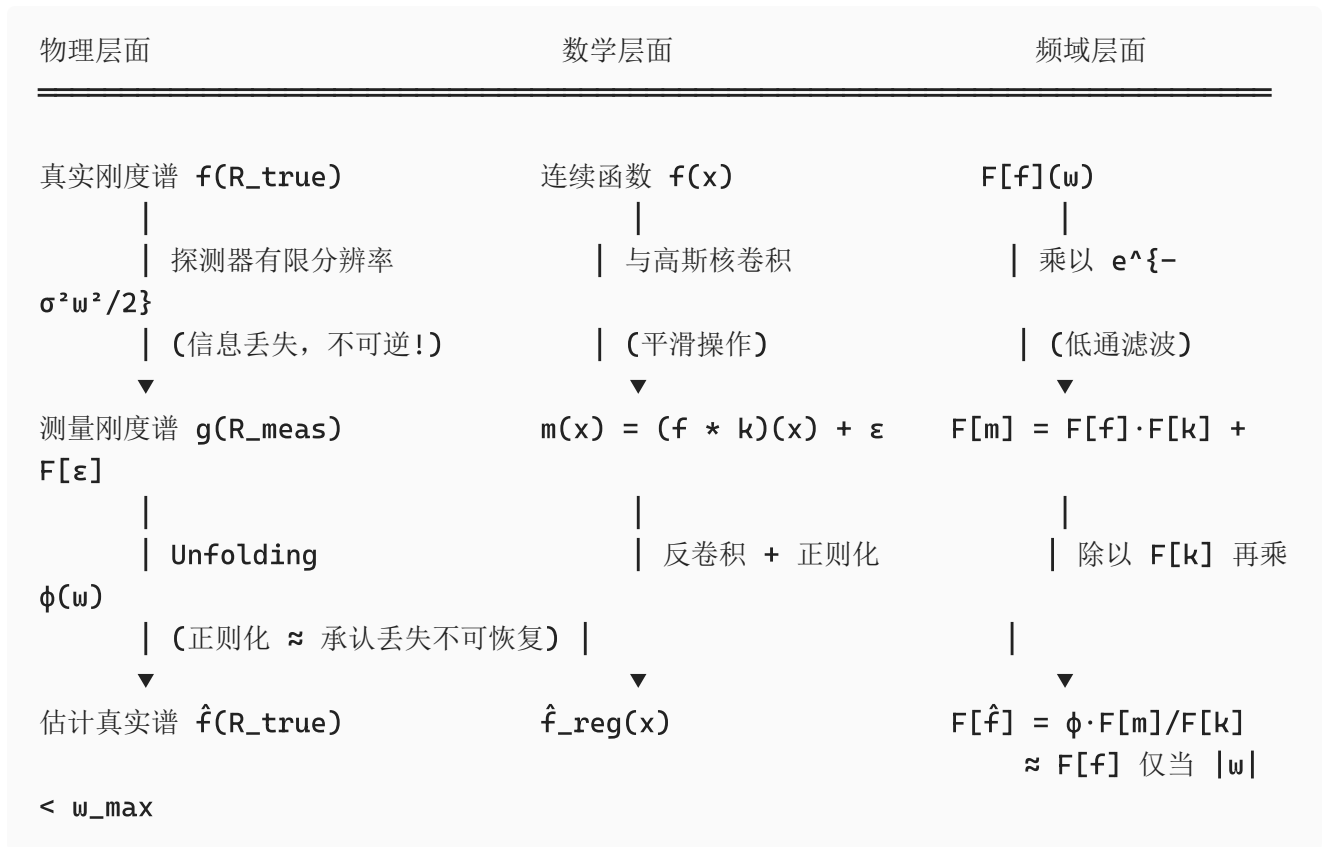
Tikhonov 正则化解的频域衰减因子 $\phi(\omega) = |\mathcal{F}[k]|^2 / (|\mathcal{F}[k]|^2 + \tau^2)$ 与信号处理中的维纳滤波器 (Wiener filter) 形式完全一致：

$$\phi_{\text{Wiener}}(\omega) = \frac{|\mathcal{F}[k](\omega)|^2}{|\mathcal{F}[k](\omega)|^2 + \frac{S_\varepsilon(\omega)}{S_f(\omega)}}$$

其中 S_ε 和 S_f 分别是噪声和信号的功率谱密度。Tikhonov 的正则化参数 τ^2 等价于假设噪声与信号的功率比为常数——即假设信号和噪声都是白噪声 (各个频率分量功率相等)。更精细的 Unfolding 可以使用非均匀的 $\tau(\omega)$ ，在信号功率强 (低频) 地区少加正则化，在信号功率弱 (高频) 地区多加正则化。

五、完整的数学链条

将上述分析串成 Unfolding 的完整逻辑链：



六、总结

$$\delta \xrightarrow{\text{卷积 } \sigma_R} \text{Gaussian}(\sigma_R) \xrightarrow{\text{反卷积 (无噪声)}} \delta$$

$$\delta \xrightarrow{\text{卷积 } \sigma_R} \text{Gaussian}(\sigma_R) + \varepsilon \xrightarrow{\text{反卷积 (有噪声, 无正则化)}} \text{振荡灾难}$$

$$\delta \xrightarrow{\text{卷积 } \sigma_R} \text{Gaussian}(\sigma_R) + \varepsilon \xrightarrow{\text{反卷积 + 正则化}} \text{Gaussian}(\sigma_R) \text{ (最细可恢复结构 } \sim \sigma_R)$$

三条结论：

1. **正演（卷积/Folding）使信息不可逆地丢失：** δ 函数的无限尖锐（包含所有频率分量）被高斯核的低通滤波效应（ $e^{-\sigma^2\omega^2/2}$ ）衰减，高频分量在测量谱中变得极其微弱。
2. **反演（反卷积/Unfolding）是病态的：**要恢复高频分量，必须在频域除以 $e^{-\sigma^2\omega^2/2}$ ，即乘以 $e^{+\sigma^2\omega^2/2}$ ——这同时将噪声高频分量以相同指数倍率放大。频率越高，信噪比越低，直到噪声完全淹没信号。
3. **正则化 = 在高频端认输：**所有正则化方法（SVD 截断、Tikhonov 惩罚、贝叶斯迭代截止）本质上都是同一个操作——在高频端对反卷积放大因子设置上限，主动放弃恢复那些本质上已被探测器分辨率抹去的亚分辨率结构。

一句话：探测器分辨率 σ_R 是信息丢失的不可逾越的尺度——你可以在 σ_R 内用正则化换取稳定，但不能恢复已经被分辨率永久抹去的东西。

参考文献

- G. Cowan, *Statistical Data Analysis*, Oxford (1998), Chapter 11 — Unfolding 的经典教材级阐述
- A. N. Tikhonov & V. Y. Arsenin, *Solutions of Ill-Posed Problems* (1977) — 反问题正则化理论的奠基著作
- R. N. Bracewell, *The Fourier Transform and Its Applications* (2000) — 卷积与傅里叶变换的标准参考
- 与同一目录下的 [筛选条件详解](#) 和上级目录的 [Unfolding 完整理论](#) 配套阅读